PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication numb r:

11-096506

(43)Dat of publication f application: 09.04.1999

(51)Int.Cl.

G11B 5/02 606K 17/00 611B 5/09

(21)Application number: 09-254954

(71)Applicant: SANKYO SEIKI MFG CO LTD

(22) Date of filing:

19.09.1997

(72)Inventor: TAKITA YUKIHIKO

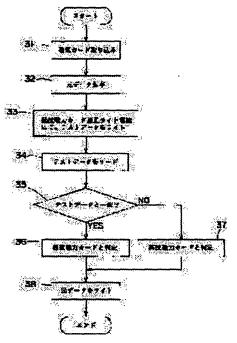
NAKAZAWA AKIRA

IMAI EIJI

(54) MAGNETIC CARD READER, AND METHOD FOR JUDGING COERCIVE FORCE OF MAGNETIC CARD IN THE **MAGNETIC CARD READER**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To automatically judge the coercive force of a magnetic card to be used in a magnetic card reader. SOLUTION: This magnetic card reader for reproducing or recording the magnetic information formed to the card inserted through a card inserting port by a magnetic head, is provided with a judgment means for judging the coercive force of a data track for recording the magnetic information. After test data recorded on the data track of a taken-in magnetic card (a step S31) with the current corresponding to a low coercive force (a step 33), the test data are reproduced (a step 34), and when the reproduced data is matched with the test data (a step 35), it is judged that the coercive force of the taken-in card is low.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.02.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rjctin]

[Dat of r qu sting appeal against xaminer's decision f

r jection]

[Dat of xtincti n of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Offic

Searching PAJ 1/1 nago

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平11-96506

(43)公開日	平成11年(1999)4月9日
(40/ 42/00 11	TULL 1 TO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

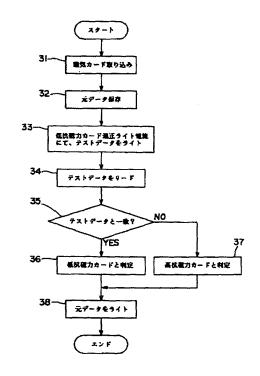
(51) Int. Cl.	Int. Cl. ^e			FΙ						
G 1 1 B	5/02				G 1 1 B	5/02		Z		
G06K	17/00				G06K	17/00		Α		
G 1 1 B	5/09	3 6	1		G 1 1 B	5/09	361	Z		
	審査請求	未請求	請求項の数 9	OL			(全1	3頁)		
(21)出願番号	+ 特願平9−254954				(71)出願人		000002233			
						株式会	社三協精	幾製作所		
(22)出願日	平成9年(1997)9月19日					長野県	諏訪郡下記	諏訪町5329番地		
					(72)発明者	雅田	幸彦			
								吋10801番地の2	株式会社	
						三協精	機製作所認	諏訪南工場内		
					(72)発明者	中沢	明			
						長野県	諏訪郡原	寸10801番地の2	株式会社	
						三協精	機製作所認	諏訪南工場内		
					(72)発明者	今井	栄治			
						長野県	諏訪郡原本	付10801番地の2	株式会社	
						三協精	機製作所記	諏訪南工場内		
					(74)代理人	、 弁理士	村瀬 -	一美		

(54) 【発明の名称】磁気カードリーダ及び磁気カードリーダにおける磁気カードの抗磁力判定方法

(57)【要約】

【課題】 使用される磁気カードの抗磁力を自動的に判 定する。

【解決手段】 カード挿入口より挿入したカードに形成 された磁気情報を磁気ヘッドにより再生又は記録するよ うにした磁気カードリーダにおいて、磁気情報を記録す るためのデータトラックの抗磁力を判定する判定手段を 設けた。取り込んだ磁気カード (ステップS31) のデ ータトラックに低抗磁力カードに対応する電流にてテス トデータを記録した (ステップS33) 後再生し (ステ ップS34)、この再生データがテストデータと一致 (ステップS35) した場合に低抗磁力カードであると 判定する(ステップS36)。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 カード挿入口より挿入したカードに形成 された磁気情報を磁気ヘッドにより再生又は記録するよ うにした磁気カードリーダにおいて、上記磁気情報を記 録するためのデータトラックの抗磁力を判定する判定手 段を設けたことを特徴とする磁気カードリーダ。

【請求項2】 上記判定手段は、上記磁気ヘッドを介し て所定の電流にてデータを記録又は消去すると共にその データの再生を行って上記抗磁力を判定する抗磁力判定 部を有することを特徴とする請求項1記載の磁気カード 10 リーダ。

【請求項3】 上記所定の電流にてデータを記録する前 に上記データトラックに記録されたデータを記憶してお く記憶部を有することを特徴とする請求項2記載の磁気 カードリーダ。

【請求項4】 カード挿入口より挿入したカードに形成 された磁気情報を磁気ヘッドにより再生又は記録するよ うにした磁気カードリーダにおいて、上記磁気ヘッドに よりデータトラックに所定の電流にてデータを記録又は 消去した後データの再生出力により上記データトラック 20 の抗磁力を判定するようにしたことを特徴とする磁気力 ードリーダにおける磁気カードの抗磁力判定方法。

【請求項5】 上記データトラックに所定の電流にてデ ータを記録又は消去する前に、上記データトラックのデ ータを再生してメモリしておき、上記抗磁力の判定後に 上記メモリしたデータを上記データトラックに記録する ことを特徴とする請求項4記載の磁気カードリーダにお ける磁気カードの抗磁力判定方法。

【請求項6】 上記データトラックに低抗磁力カードに の再生データが上記テストデータと一致した場合に低抗 磁力カードであると判定することを特徴とする請求項4 又は5記載の磁気カードリーダにおける磁気カードの抗 磁力判定方法。

【請求項7】 上記データトラックに高抗磁力カードに 対応する電流にてテストデータを記録し、その後の再生 出力が所定値以上得られた場合に高抗磁力カードである と判定することを特徴とする請求項4又は5記載の磁気 カードリーダにおける磁気カードの抗磁力判定方法。

ータを一度消去した後、低抗磁力カードに対応する電流 にてテストデータを記録し、その後の再生出力が所定値 以上得られた場合に低抗磁力カードであると判定するこ とを特徴とする請求項4又は5記載の磁気カードリーダ における磁気カードの抗磁力判定方法。

【請求項9】 上記データトラックに記録されている記 録データを低抗磁力カードのデータのみ消去可能な電流 にて消去し、その後の再生出力が所定値以上得られた場 合に高抗磁力カードであると判定することを特徴とする

ードの抗磁力判定方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気カードリーダ 及び磁気カードリーダにおける磁気カードの抗磁力判定 方法に関する。より詳しくは、本発明は、磁気カードの 抗磁力の高低を自動判定する機能を有する磁気カードリ ーダ及び磁気カードリーダにおける磁気カードの抗磁力 判定方法に関するものである。

2

[0002]

【従来の技術】従来の磁気カードリーダでは抗磁力が同 じ磁気カードを使用していた。即ち、予め上位からの信 号により用いる磁気カードの抗磁力が指定されており、 2種類以上の抗磁力の磁気カードを処理できる磁気カー ドリーダはなかった。したがって、磁気カードリーダ は、使用する磁気カードの抗磁力を判定する機能を有し ていなかった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】近年、磁気カードの抗 磁力を大きくする傾向がある。例えば、抗磁力が300 Oeの低抗磁力カードを、抗磁力が2750Oeの高抗 磁力カードに切り換える動きがある。このため、過渡期 には、低抗磁力カードと高抗磁力カードの両方の磁気カ ードが同時に使用される可能性がある。一般に、抗磁力 の異なる磁気カードをライトする場合、抗磁力に応じた 適正なライト電流を設定しないと適正なカード出力を得 ることができない。したがって、カード挿入口に挿入さ れた磁気カードの抗磁力に応じて適正なライト電流を設 定するために、当該磁気カードが高抗磁力カードである 対応する電流にてテストデータを記録した後再生し、こ 30 か低抗磁力カードであるかを判定する機能を磁気カード リーダに備える必要がある。

> 【0004】本発明は、使用される磁気カードの抗磁力 を判定することができる磁気カードリーダ及び磁気カー ドリーダにおける磁気カードの抗磁力判定方法を提供す ることを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】かかる目的を達成するた めに請求項1記載の磁気カードリーダは、カード挿入口 より挿入したカードに形成された磁気情報を磁気ヘッド 【請求項8】 上記データトラックに記録されているデ 40 により再生又は記録するようにした磁気カードリーダに おいて、磁気情報を記録するためのデータトラックの抗 磁力を判定する判定手段を設けた構成である。したがっ て、カード挿入口より磁気カードが挿入されると、判定 手段がデータトラックの抗磁力を判定し、その抗磁力に 適した電流値でデータがライトされる。

【0006】この場合、請求項2記載の発明のように、 判定手段は、磁気ヘッドを介して所定の電流にてデータ を記録又は消去すると共にそのデータの再生動作を行っ て抗磁力を判定する抗磁力判定部を有することが望まし 請求項4又は5記載の磁気カードリーダにおける磁気カ 50 い。この場合には、データを記録又は消去する電流の値 3

とデータの再生による出力値とに基づいて、判定手段が 磁気カードの抗磁力を判定する。

【0007】また、請求項3記載の磁気カードリーダは、所定の電流にてデータを記録する前にデータトラックに記録されたデータを記憶しておく記憶部を有する構成である。したがって、記憶部にデータトラックのデータを退避させた状態でデータトラックの抗磁力の判定が行われる。

【0009】この場合、請求項5記載の磁気カードの抗磁力判定方法のように、データトラックに所定の電流に 20 てデータを記録又は消去する前に、データトラックのデータを再生してメモリしておき、抗磁力の判定後にメモリしたデータをデータトラックに記録することが望ましい。したがって、抗磁力の判定のためにデータトラックの内容を書き換える場合であってもデータトラックに予め記録されていたデータを保存できる。

【0010】また、請求項6記載の磁気カードの抗磁力判定方法は、データトラックに低抗磁力カードに対応する電流にてテストデータを記録した後再生し、この再生データがテストデータと一致した場合に低抗磁力カード30であると判定することを特徴とするものである。使用される磁気カードが低抗磁力カードであればテストデータの記録が良好になり、再生データがテストデータと一致する。一方、使用される磁気カードが高抗磁力カードであればテストデータと間違する。したがって、再生データとテストデータと相違する。したがって、再生データとテストデータとの関係から使用される磁気カードが低抗磁力カードか高抗磁力カードが割定される。

【0011】また、請求項7記載の磁気カードの抗磁力判定方法は、データトラックに高抗磁力カードに対応す 40 る電流にてテストデータを記録し、その後の再生出力が所定値以上得られた場合に高抗磁力カードであると判定することを特徴とするものである。使用される磁気カードが高抗磁力カードであればテストデータは良好に記録され、所定値以上の再生出力を得ることができる。一方、使用される磁気カードが低抗磁力カードであればテストデータの記録は不十分であり、再生出力は所定値よりも小さくなる。したがって、再生出力の大きさから使用された磁気カードが高抗磁力カードか低抗磁力カードかが判定される。

【0012】また、請求項8記載の磁気カードの抗磁力判定方法は、データトラックに記録されているデータを一度消去した後、低抗磁力カードに対応する電流にてテストデータを記録し、その後の再生出力が所定値以上得られた場合に低抗磁力カードであると判定することを特徴とするものである。使用される磁気カードが低抗磁力カードであればテストデータは良好に記録され、所定値以上の再生出力を得ることができる。一方、使用される磁気カードが高抗磁力カードであればテストデータの記録は不十分であり、再生出力は所定値よりも小さくなる。したがって、再生出力の大きさから使用された磁気カードが低抗磁力カードか高抗磁力カードかが判定される

【0013】さらに、請求項9記載の磁気カードの抗磁力判定方法は、データトラックに記録されている記録データを低抗磁力カードのデータのみ消去可能な電流にて消去し、その後の再生出力が所定値以上得られた場合に高抗磁力カードであると判定することを特徴とするものである。使用される磁気カードが高抗磁力カードであればデータの消去は不十分であり、所定値以上の再生出力を得ることができる。一方、使用される磁気カードが低抗磁力カードであればデータは良好に消去され、再生出力は所定値よりも小さくなる。したがって、再生出力の大きさから使用された磁気カードが高抗磁力カードか低抗磁力カードが判定される。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の構成を図面に示す 最良の形態に基づいて詳細に説明する。

【0015】図1に、本発明を適用した磁気カードリーダの実施形態の一例を示す。なお、本実施形態のカードリーダは、例えば3000eの低抗磁力カードと27500eの高抗磁力カードに対応するものである。

【0016】磁気カードリーダは、カード挿入口2より 挿入した磁気カード1に形成された磁気情報を磁気ヘッ ド3により再生又は記録するようにしたもので、磁気情 報を記録するためのデータトラックの抗磁力を判定する 判定手段を備えている。判定手段は、磁気ヘッド3を介 して所定の電流にてデータを記録又は消去すると共にそ のデータの再生を行って磁気カード1の抗磁力を判定す る抗磁力判定部4を有している。また、制御部10は、 所定の電流にてデータを記録する前にデータトラックに 記録されたデータを記憶しておく元データメモリ(記憶 部)5を有している。

【0017】カード挿入口2より挿入された磁気カード 1は、カード走行駆動手段6によって駆動されるローラ 対7,7により搬送される。カード走行駆動手段6はセ ンサ8,8からの信号に基づいてローラ対7,7を正逆 両方向に回転させる。

【0018】磁気ヘッド3は、例えば27500eの高 50 抗磁力カード用のもので、電流の大きさを変化させるこ

とで30000の低抗磁力カード用としても使用するこ とができる。この磁気ヘッド3は、記録及び再生の機能 を有する磁気ヘッドであり、磁気ヘッド制御部9によっ て制御される。この磁気ヘッド3で高抗磁力カードをラ イトした場合のライト特性を図2に示す。飽和電流値は 125mA0-pである。ライト電流は、磁気ヘッド3 のライト能力のマージン等を考慮し、飽和電流値の1. 5~3倍程度にするのが一般的である。 ISOの高抗磁 力カードのテスト書込み電流の規定では、飽和電流値の 80%の出力のとれる電流値の2.5~3.5倍の値で 10 ライトするようになっている。即ち、飽和時の出力が 7. 8mVであることから、7. 8×0. 8=6. 24 mVが飽和時の出力の80%の値となる。この出力がと れるライト電流値は、66mAである(図2)。そし て、66mAを3倍すると、66×3=198mA≒2 00mAとなり、高抗磁力カードをライトする時の適正 ライト電流は、おおよそ200mA0-pである。

【0019】一方、この磁気ヘッド3で低抗磁力カードをライトした場合のライト特性を図3に示す。飽和電流値は12.5mAである。飽和電流値の80%の出力が20とれる電流値は7.5mAであり、7.5×3=22.5mA0-p(ゼローピーク)程度が適正ライト電流値になる。

【0020】図4は、図3の特性についてさらに電流値を大きくしていった場合の特性を示す。いま、高抗磁力カード用の適正ライト電流で低抗磁力カードをライトした場合を考える。つまり、低抗磁力カードを200mA0ーpでライトすることになり、図4に示すように、ライト電流が過大となり、出力が2.6÷5.7×100=46%におちる。飽和時の46%しか出力が出ない磁30気カード1をデータリードする時、曲がりカード等のスペーシングなどを考慮すると、さらに出力が低下し、データリードできないカードが出てくる虞がある。以上の通り、高抗磁力カード用の適正ライト電流で低抗磁力カードをライトした場合には、適切なリード出力を得ることができない。同様にして、低抗磁力カード用の適正ライト電流で高抗磁力カードをライトした場合にも、適切なリード出力を得ることができない。

【0021】即ち、低抗磁力カードを、低抗磁力カード 適正ライト電流にてライトした場合には飽和時の90% 40 以上の出力が得られるのに対し、高抗磁力カード適正ライト電流にてライトした場合には出力が飽和時の46% 程度に下がる。また、高抗磁力カードを、低抗磁力カー ド適正ライト電流にてライトした場合にはライト前のデータがそのまま残る(データが予め消去されていたときには出力が出ない)のに対し、高抗磁力カード適正ライト電流にてライトした場合には飽和時の90%以上の出力が得られる。本発明では、これらの原理に基づいて低抗磁力カードと高抗磁力カードとを判定している。

【0022】次に、磁気カード1の抗磁力判定方法につ 50 正ライト電流)にてテストデータを記録し、その後の再

いて説明する。制御部10は以下に説明するプログラム を実行して抗磁力を判定する。

6

【0023】図5に示す第1の方法では、磁気カード1のデータトラックに低抗磁力カードに対応する電流(低抗磁力カード適正ライト電流)にてテストデータを記録した後再生し、この再生データがテストデータと一致した場合に低抗磁力カードであると判定する。また、データトラックに所定の電流にてテストデータを記録する前に、データトラックのデータを再生してメモリしておき、抗磁力の判定後にメモリしたデータをデータトラックに記録する。

【0024】具体的に説明すると、先ず、カード挿入口 2から磁気カード1を取り込んだ (ステップS31) 後、磁気カード1のデータトラックに既に記録されてい るデータ(以下、元データという)をリードして元デー タメモリ5に保存しておく(ステップS32)。次に、 低抗磁力カードをライトする電流22.5mA0-pに てテストデータをライトする(ステップS33)。ここ で、テストデータは、元データと異なるデータである。 【0025】次に、ライトしたテストデータをリードす る(ステップS34)。いま、カードリーダに入ってき た磁気カード1が低抗磁力カードであればデータトラッ クの内容はテストデータで書き換えられているはずであ り、リードしたデータはテストデータに一致するはずで ある。したがって、リードしたデータとテストデータと を比較し(ステップS35)、これらが一致する場合に は磁気カード1が低抗磁力カードであると判定し (ステ ップS36)、データトラックに元データを適正な電流 値でライト (ステップS38) した後このプログラムを 終了する。

【0026】一方、カードリーダに入ってきた磁気カード1が高抗磁力カードであればデータトラックの内容はテストデータで書き換えられていないはずであり、リードしたデータはテストデータとは異なるはずである。したがって、リードしたデータとテストデータとが一致しない場合には磁気カード1が高抗磁力カードであると判定し(ステップS37)、データトラックに元データを適正な電流値でライト(ステップS38)した後このプログラムを終了する。

【0027】このようにして磁気カード1が低抗磁力カードであるか高抗磁力カードであるかの判定を行った後、各カードにおける適正なライト電流によりデータのライトを行う。したがって、高抗磁力カードと低抗磁力カードとが混じって市場に流通しても、抗磁力を自動的に判定することができ、同一のカードリーダでこれらの磁気カードを処理することができる。

【0028】次に、図6に基づいて第2の方法について 説明する。この方法では、磁気カード1のデータトラックに高抗磁力カードに対応する電流(高抗磁力カード適 エライト電流)にブラストデータを配給) その後の再 (5)

生出力が所定値以上得られた場合に高抗磁力カードであると判定する。また、データトラックに所定の電流にてテストデータを記録する前に、データトラックのデータをリードしてメモリしておき、抗磁力の判定後にメモリしたデータをデータトラックにライトする。

【0029】具体的に説明すると、先ず、カード挿入口2から磁気カード1を取り込んだ(ステップS41)後、元データをリードして元データメモリ5に保存しておく(ステップS42)。次に、高抗磁力カードをライトする電流200mA0-pにてテストデータをライト10する(ステップS43)。

【0030】そして、ライトしたテストデータをリードする(ステップS44)。いま、カードリーダに入ってきた磁気カード1が高抗磁力カードであればデータトラックにはテストデータが良好にライトされているはずであり、リード出力は所定値以上になるはずである。したがって、リード出力が所定値以上であるか否かを判断し(ステップS45)、所定値以上の場合には磁気カード1が高抗磁力カードであると判定し(ステップS46)、データトラックに元データを適正な電流値でライ20ト(ステップS48)した後このプログラムを終了する。

【0031】一方、カードリーダに入ってきた磁気カード1が低抗磁力カードであればテストデータのデータトラックへのライトは不十分となって、リード出力は所定値未満になるはずである。したがって、この場合には磁気カード1が低抗磁力カードであると判定し(ステップS47)、データトラックに元データを適正な電流値でライト(ステップS48)した後このプログラムを終了する。

【0032】なお、ステップS45の所定値としては、 磁気カード1の出力ばらつき等を考慮して飽和時の値の 例えば60%程度の値とすることが好ましい。

【0033】次に、図7に基づいて第3の方法について 説明する。この方法では、磁気カード1のデータトラッ クに記録されているデータを一度消去した後、低抗磁力 カードに対応する電流にてテストデータを記録し、その 後の再生出力が所定値以上得られた場合に低抗磁力カー ドであると判定する。また、データトラックに所定の電 流にてテストデータを消去する前に、データトラックの 40 データをリードしてメモリしておき、抗磁力の判定後に メモリしたデータをデータトラックにライトする。

【0034】具体的に説明すると、先ず、カード挿入口2から磁気カード1を取り込んだ(ステップS51)後、元データをリードして元データメモリ5に保存しておく(ステップS52)。次に、高抗磁力カード適正ライト電流200mA0-pにて元データをDC(直流)消去(ステップS53)した後、低抗磁力カード適正ライト電流22.5mA0-pにてテストデータをライトする(ステップS54)。

【0035】そして、ライトしたテストデータをリードする(ステップS55)。いま、カードリーダに入ってきた磁気カード1が低抗磁力カードであればデータトラックにはテストデータが良好にライトされているはずであり、リード出力は所定値以上になるはずである。したがって、リード出力が所定値以上であるか否かを判断し(ステップS56)、所定値以上の場合には磁気カード1が低抗磁力カードであると判定し(ステップS57)、データトラックに元データを適正な電流値でライト(ステップS59)した後このプログラムを終了する。

【0036】一方、カードリーダに入ってきた磁気カード1が高抗磁力カードであればテストデータのデータトラックへのライトは不適切であり、リード出力は所定値未満になるはずである。したがって、この場合には磁気カード1が高抗磁力カードであると判定し(ステップS58)、データトラックに元データを適正な電流値でライト(ステップS59)した後このプログラムを終了する。

【0037】次に、図8に基づいて第4の方法について 説明する。この方法では、磁気カード1のデータトラッ クに記録されている記録データを低抗磁力カードのデー タのみ消去可能な電流にて消去し、その後の再生出力が 所定値以上得られた場合に高抗磁力カードであると判定 する。また、データトラックに所定の電流にてテストデ ータを消去する前に、データトラックのデータをリード してメモリしておき、抗磁力の判定後にメモリしたデー タをデータトラックにライトする。

【0038】具体的に説明すると、先ず、カード挿入口 2から磁気カード1を取り込んだ(ステップS61)後、元データをリードして元データメモリ5に保存しておく(ステップS62)。次に、低抗磁力カード適正ライト電流22.5mA0-pにて元データをDC(直流)消去(ステップS63)した後、元データをリードする(ステップS64)。

【0039】いま、カードリーダに入ってきた磁気カード1が高抗磁力カードであれば、低抗磁力カード適正ライト電流ではデータ消去を良好に行うことができずに元データが残っているはずであり、リード出力は所定値以上になるはずである。したがって、リード出力が所定値以上であるか否かを判断し(ステップS65)、所定値以上の場合には磁気カード1が高抗磁力カードであると判定し(ステップS66)、データトラックに元データを適正な電流値でライト(ステップS68)した後このプログラムを終了する。

【0040】一方、カードリーダに入ってきた磁気カード1が低抗磁力カードであれば元データは良好に消去されているはずであり、リード出力は所定値未満になるはずである。したがって、この場合には磁気カード1が低50 抗磁力カードであると判定し(ステップS67)、デー

タトラックに元データを適正な電流値でライト(ステッ プS68) した後このプログラムを終了する。

【0041】なお、上述の形態は本発明の好適な形態の 一例ではあるがこれに限定されるものではなく本発明の 要旨を逸脱しない範囲において種々変形実施可能であ る。例えば、上述の説明では、低抗磁力カードとして3 000eのものを、高抗磁力カードとして27500e のものを判別するようにしたが、抗磁力の大きさとして はこれらに限るものではないことは勿論である。

【0042】また、上述の説明では、1つの磁気ヘッド 10 3を用いてリード、ライト、消去を行っていたが、これ らを別々の磁気ヘッドで行うようにしても良い。この場 合には、カード走行1回での処理が可能である。

【0043】さらに、上述の説明では、磁気カードの抗 磁力を判定する前に元データの保存を行っていたが、元 データを保存しておく必要が無い場合には元データの保 存ステップ及びライトステップを省略しても良い。

[0044]

【発明の効果】以上説明したように請求項1記載の磁気 ックの抗磁力を判定する判定手段を設けているので、た とえ抗磁力の異なる磁気カードを使用した場合であって も、各磁気カードに対し適正なライト電流にてデータを ライト処理することができる。

【0045】この場合、請求項2記載の発明のように、 判定手段は、磁気ヘッドを介して所定の電流にてデータ を記録又は消去すると共にそのデータの再生を行って抗 磁力を判定する抗磁力判定部を有することが望ましい。 この様にすることで、データを記録又は消去する電流の 値とデータの再生動作による出力値とに基づいて磁気カ 30 ードの抗磁力を判定することができる。

【0046】また、請求項3記載の磁気カードリーダ は、所定の電流にてデータを記録する前にデータトラッ クに記録されたデータを記憶しておく記憶部を有するの で、データトラックのデータを保存しておくことができ る。

【0047】また、請求項4記載の磁気カードリーダに おける磁気カードの抗磁力判定方法は、カード挿入口よ り挿入したカードに形成された磁気情報を磁気ヘッドに より再生又は記録するようにした磁気カードリーダにお 40 へのライト特性を示し、図3の特性についてさらに電流 いて、磁気ヘッドによりデータトラックに所定の電流に てデータを記録又は消去した後データの再生出力により データトラックの抗磁力を判定することを特徴とするの で、データを記録又は消去した電流値と再生出力値との 関係から磁気カードの抗磁力を判定することができる。

【0048】この場合、請求項5記載の磁気カードの抗 磁力判定方法のように、データトラックに所定の電流に てデータを記録又は消去する前に、データトラックのデ ータを再生してメモリしておき、抗磁力の判定後にメモ リしたデータをデータトラックに記録することが望まし 50

10 い。この様にすることで、データトラックのデータを保 存しておくことができる。

【0049】また、請求項6記載の磁気カードの抗磁力 判定方法は、データトラックに低抗磁力カードに対応す る電流にてテストデータを記録した後再生し、この再生 データがテストデータと一致した場合に低抗磁力カード であると判定するので、再生データとテストデータとの 関係から使用される磁気カードが低抗磁力カードである か高抗磁力カードであるかを判定することができる。

【0050】また、請求項7記載の磁気カードの抗磁力 判定方法は、データトラックに高抗磁力カードに対応す る電流にてテストデータを記録し、その後の再生出力が 所定値以上得られた場合に高抗磁力カードであると判定 するので、再生出力の大きさから使用された磁気カード が高抗磁力カードであるか低抗磁力カードであるかを判 定することができる。

【0051】また、請求項8記載の磁気カードの抗磁力 判定方法は、データトラックに記録されているデータを 一度消去した後、低抗磁力カードに対応する電流にてテ カードリーダは、磁気情報を記録するためのデータトラ 20 ストデータを記録し、その後の再生出力が所定値以上得 られた場合に低抗磁力カードであると判定するので、再 生出力の大きさから使用された磁気カードが低抗磁力力 ードであるか高抗磁力カードであるかを判定することが できる。

> 【0052】さらに、請求項9記載の磁気カードの抗磁 力判定方法は、データトラックに記録されている記録デ ータを低抗磁力カードのデータのみ消去可能な電流にて 消去し、その後の再生出力が所定値以上得られた場合に 高抗磁力カードであると判定するので、再生出力の大き さから使用された磁気カードが高抗磁力カードであるか 低抗磁力カードであるかを判定することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明を適用した磁気カードリーダの実施形態 の一例を示す概略構成図である。

【図2】高抗磁力カード用ヘッドによる高抗磁力カード へのライト特性図である。

【図3】高抗磁力カード用ヘッドによる低抗磁力カード へのライト特性図である。

【図4】高抗磁力カード用ヘッドによる低抗磁力カード 値を大きくした場合の特性図である。

【図5】本発明を適用した磁気カードリーダにおける磁 気カードの抗磁力判定方法の第1の実施形態を示す流れ 図である。

【図6】本発明を適用した磁気カードリーダにおける磁 気カードの抗磁力判定方法の第2の実施形態を示す流れ 図である。

【図7】本発明を適用した磁気カードリーダにおける磁 気カードの抗磁力判定方法の第3の実施形態を示す流れ 図である。

11

【図8】本発明を適用した磁気カードリーダにおける磁気カードの抗磁力判定方法の第4の実施形態を示す流れ図である。

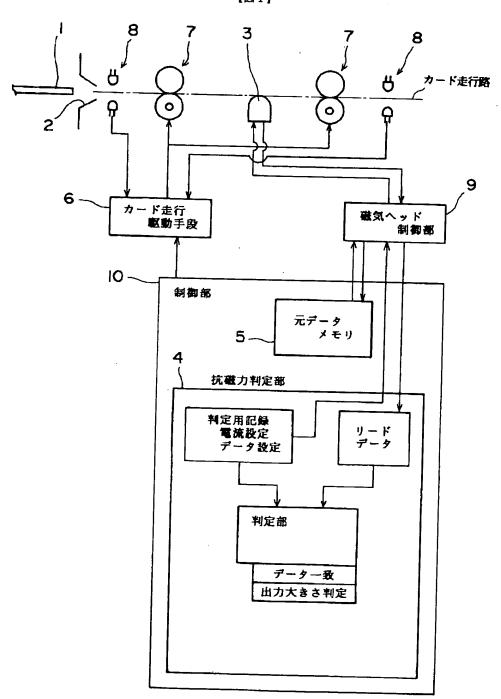
【符号の説明】

1 磁気カード

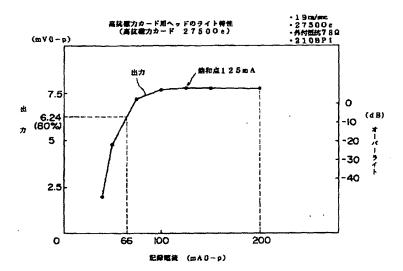
- 2 カード挿入口
- 3 磁気ヘッド
- 4 抗磁力判定部
- 5 元データメモリ (記憶部)

12

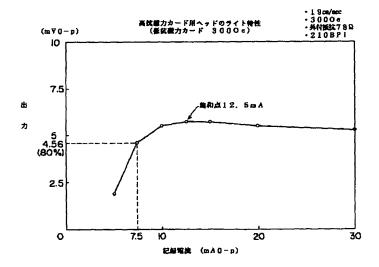
【図1】



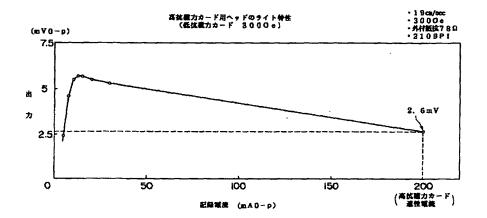
【図2】



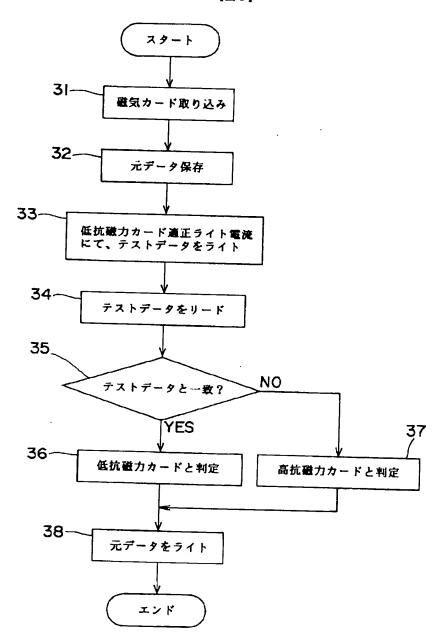
【図3】



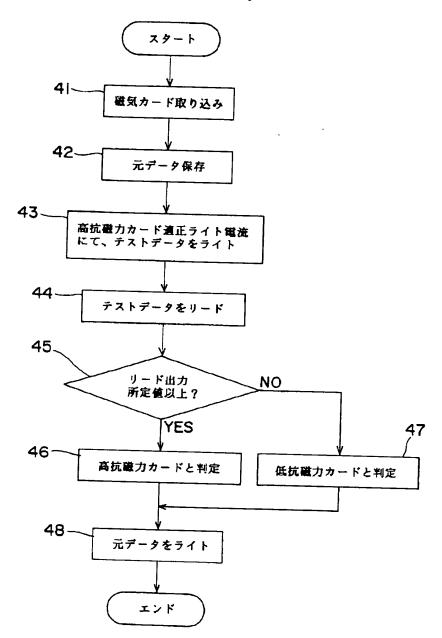
【図4】



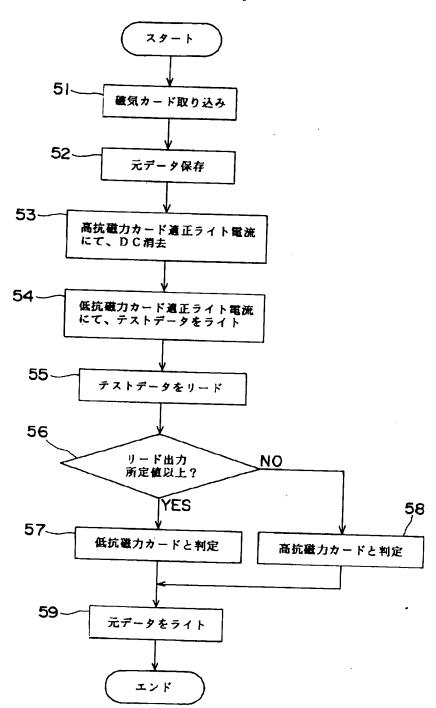
【図5】



【図6】







【図8】

